

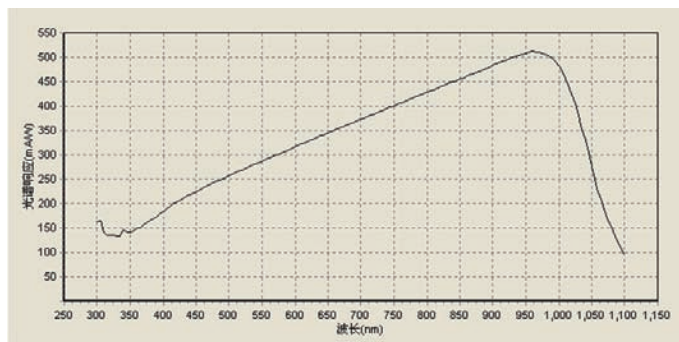
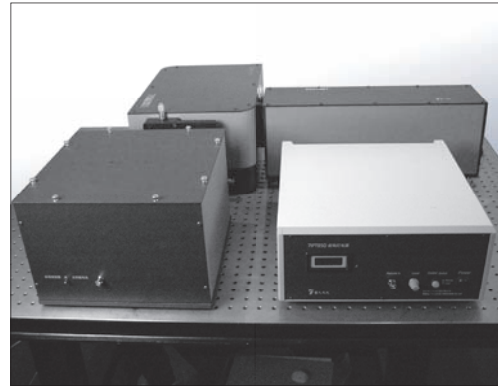


7-DRSpec探测器光谱响应测试系统 (Detector Response Measurements System)

该测试系统为自动测试系统，具有测试快速准确、操作简单、可靠性高的特点，能实现 200-2500nm 范围内绝对光谱响应度、量子效率、归一化探测率、信号电压、噪声电压、响应时间等参数随波长、频率、外加偏压的变化曲线的全自动测试。

技术指标：

- 光谱范围：200-2500nm（可根据实际需要选择）
- 光电源电流漂移： $<0.04\%/h$
- 波长准确度： $\pm 0.2nm$
- 光谱分辨率： $\pm 0.1nm$
- 光谱带宽：0.2-10nm 可调
- 光斑：15mm，各点不均匀性 $<1\%$
- 偏压源：电压：200uV-505V；电流：20fA-20mA
- 系统噪声： $<2mV$
- 系统重复性： $<2\%$
- 激光监视光路：CCD 图像监视，可对极小光电探测器进行精确定位。

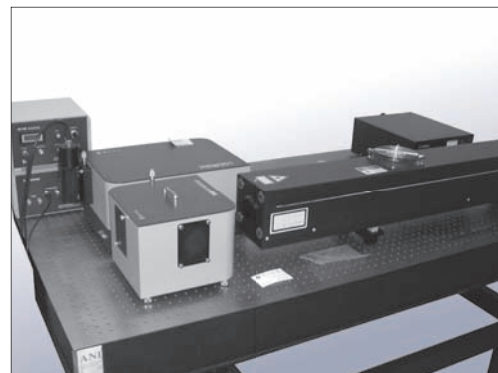


实测Si探测器光谱响应曲线

7-PLSpec系列光致发光光谱测试系统 (Photoluminescence Measurements System)

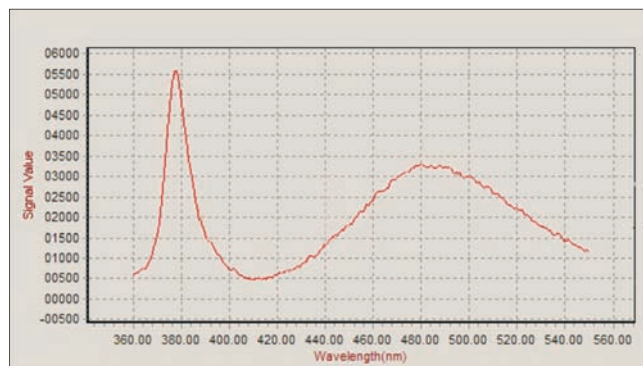
系统型号	系统特点
7-PLSpec I	常温扫描型
7-PLSpec II	低温扫描型
7-PLSpec M	Mini 摄谱型

本系统可以测试半导体材料或其他发光特性材料在激光激发下产生的荧光光谱。通常情况下采用紫外或近紫外激光激发半导体材料（如 GaN、ZnO、CdTe 等）产生荧光；或用可见、红外激光器激发稀土掺杂的玻璃或晶体材料产生的荧光，通过对其荧光光谱的测量，分析材料能带结果等特征。



技术指标：

- 光谱范围：200-2500nm（可根据实际需要选择）
- 波长准确度： $\pm 0.2nm$
- 光谱分辨率： $\pm 0.1nm$
- 光谱带宽：0.2-10nm 可调
- 光源波长：224nm、248nm、266nm、325nm、488nm、532nm、946nm、1964nm 等可选
- 可升级做透射、反射光谱测试



实测ZnO PL图谱

太阳能电池光伏测试部

光电仪器部

精密运动控制部

光具座元器件部

光学平台部

进口仪器部

7-DRSpec

7-PLSpec

7-FRSpec

7-EMSpec

7-TRASpec

7-RMSpec

7-UV001

7-CRD CCD

7-LSM LED

7-OSSR

7-ERMS